

1. Record Nr.	UNINA9910709974503321
Autore	Woo D. S.
Titolo	Characterization of silicon-gate CMOS/SOS integrated circuits processed with ion implantation / / D.S. Woo
Pubbl/distr/stampa	Marshall Space Flight Center, AL : , : George C. Marshall Space Flight Center, , January 1982
Descrizione fisica	1 online resource (v, 12 pages, 1 unnumbered page) : illustrations
Collana	NASA/CR ; ; 161988
Soggetti	Computer aided design Coding Ion implantation Masks Electron beams
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"January 1982."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical reference (page 11).